

SEM-EDX



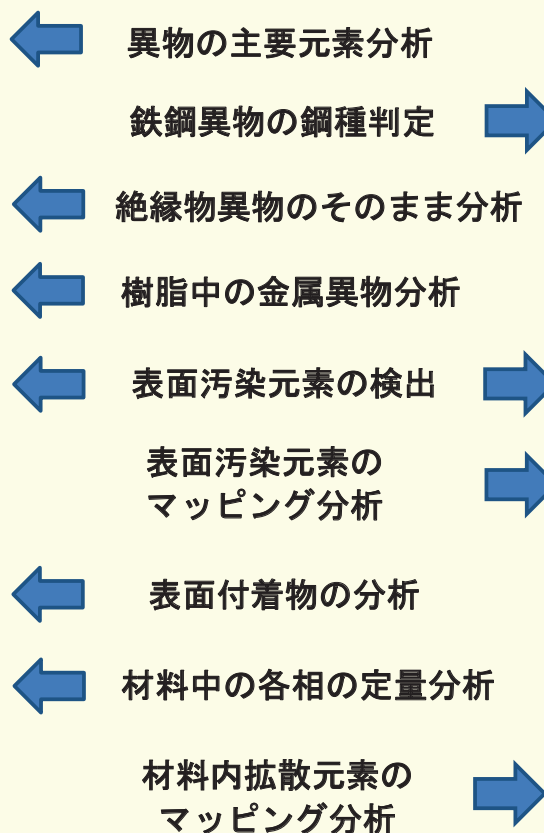
EDX : エネルギー分散型 X 線分析装置
 ※X 線パルスの高さのちがいがから、
 各元素の特性 X 線を分離検出します

分析可能元素 : B~U
 検出限界 : B~F 0. 数%
 Na~U 0. 1%
 X 線取出し角度 : 35°

- ・ 電子線ダメージを受けやすい試料
- ・ 絶縁物のそのまま分析
- ・ 低加速電圧分析
- ・ 多数点の迅速分析
- ・ 標準試料なしで定量分析

微小部元素分析

電子線を固体試料に照射し、
 発生した特性 X 線を検出します



EPMA



WDX : 波長分散型 X 線分析装置
 ※単結晶による回折で、
 各元素の特性 X 線を分離検出します

分析可能元素 : B~U
 検出限界 : B~F 数 100ppm
 Na~U < 数 10ppm
 ※鉄鋼中の C 0. 05%
 試料サイズ数 mm まで可能
 X 線取出し角度 : 52. 5°

- ・ 近接ピークの分離測定
 (高濃度元素と微量元素)
 Ag 中の Cl、Mo、Pb 中の S、Mo 中の P、B、
 Zr 中の Y、Fe 中の F など
- ・ 微量元素のマッピング分析
- ・ 重量濃度マッピング分析

最適な装置と分析方法を検討し、対応します